

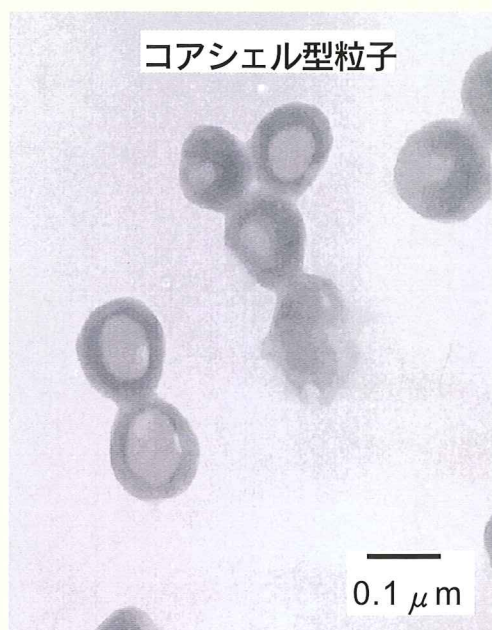
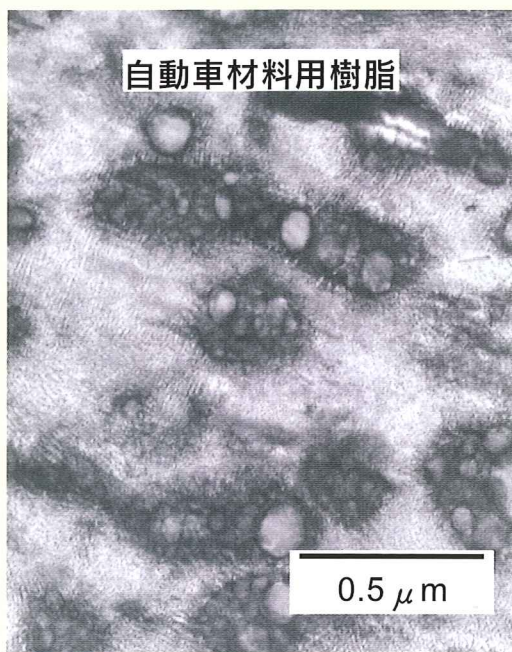
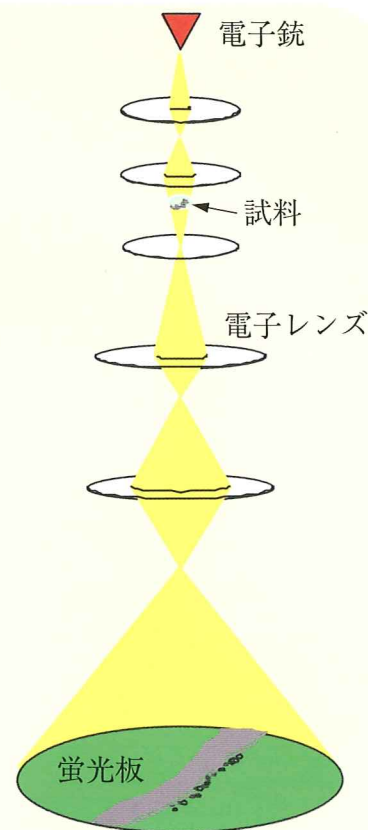
透過型電子顕微鏡 TEM (Transmission Electron Microscope)

原理・特長

光学顕微鏡に於ける光と光学レンズの代わりに、電子線と電子レンズ（磁界レンズ）を用いて、蛍光板（フィルム）に試料の拡大像を結像し、物質の形状及び内部構造を観察・撮影する装置。又、電子線回折により結晶性試料の**結晶構造**を評価できる。

仕様

	JEM-100CX	H-7000
加速電圧	20~100 kV	25~125 kV
倍率	×100~800,000	×50~600,000
線分解能	0.140 nm	0.204 nm



株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎ 03-5524-3851